

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Направление подготовки (специальность)	28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
Направленность (профиль) подготовки	Нанотехнологии и микросистемная техника
Цель освоения дисциплины	формирование знаний, умений и навыков, необходимых для успешного овладения компетенциями в области теоретического и экспериментального исследования, обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в современных условиях
Общая трудоемкость дисциплины	3 зачетных единицы, 108 часов
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой
Краткое содержание дисциплины:	1. Метрология Основные понятия и определения метрологии Размерности производных физических величин Измерения Виды и методы измерений Погрешности измерений Выявление и исключение систематических и грубых погрешностей Вероятностные методы оценки случайных погрешностей Неопределенность измерений Обработка результатов многократных измерений Обработка результатов однократных измерений Средства измерений Выбор методов и средств измерений Обеспечение единства измерений. Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКиН) Контроль качества результатов измерений 2. Стандартизация Техническое регулирование и стандартизация в Российской Федерации Принципы и методы стандартизации 3. Сертификация Подтверждение соответствия. Сертификация продукции, услуг и систем качества Процедура подтверждения соответствия. Схемы сертификации

Аннотацию рабочей программы составил Ромодановская М.П. доцент каф.УКТР
(ФИО, должность, подпись)



«30» августа 2021 г.